

SpecMetrix[®] 在线涂层厚度和膜层测量系统

- ✓ 适用各种基材 ✓ 实时工艺数据 ✓ 纳米级精度 ✓ 节省成本和时间

系统特点

- **非接触式** - 在不接触涂层或基材的情况下进行连续测量，保持产品的完整性
- **绝对厚度测量** - 提供生产卷材、单件产品和层压材料上涂层和层厚的精确测量
- **适用各种基材** - 可测量各种基材（包括金属箔、底涂纸、塑料和薄膜）上的湿涂层或干涂层；适用于任何透明、彩色或印刷基材
- **用途广泛** - 实时测量各种薄膜和卷材涂层，包括粘合剂、阻隔层、耐刮擦涂层、湿硅胶和其他功能性涂层
- **安全无害** - 采用专有的非放射性和非侵入性 ROI 和 EXR 光学技术，易于操作和维护
- **环保** - 非破坏性检测方法可有效减少废品、溶剂使用、工时和能源成本
- **灵活可拓展** - 模块化在线系统包括固定探头或横移设计，适用于单面或双面测量
- **强大的 SpecMetrix[®] 软件** - 用户友好、方便使用的软件包可将所有数据存储到 Excel[®] 或工厂网络中，便于在生产过程中或之后进行 SPC 分析

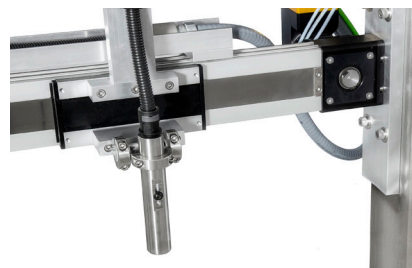


SpecMetrix 在线系统可在涂装后立即提供实时涂层和层厚测量数据，精确到亚微米级，从而改善涂装工艺控制和产品质量。

为柔性包装和 R2R 加工行业提供连续且更精确的在线涂层和层厚测量解决方案

屡获殊荣的 SpecMetrix 在线涂层测量系统为涂覆薄膜、箔片和其他卷材应用的非接触、无损、实时涂层厚度和膜层测量（无论是湿态还是干态）提供了更高的精度标准。

这些在线系统采用模块化设计，具备高速运行能力，有效减少了涂层成本，简化了不同工厂流程中的设备安装、工艺转换和检查时间，可灵活配置为固定探头或横移系统。



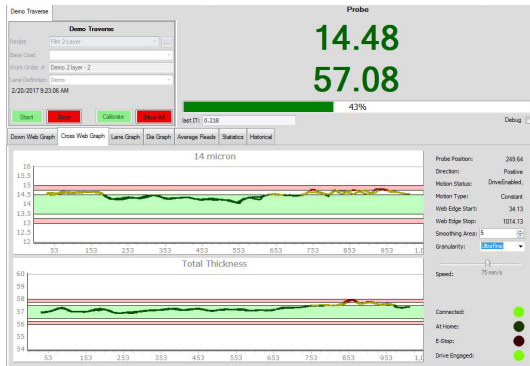
SpecMetrix 横移配置



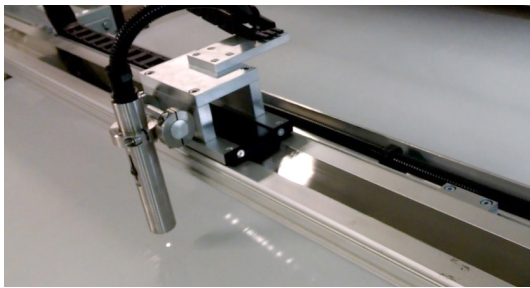
SpecMetrix 固定探头配置



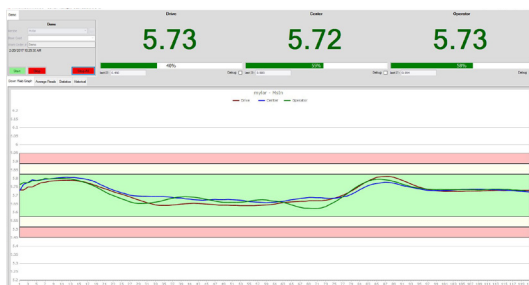
为薄膜和卷材应用提供可靠且连续的在线数据



双（顶部和底部）横移系统显示的在线测量数据



横移系统可提供横向和纵向的QA质量保证数据和分析，满足不同工厂的需求



三个固定探头系统显示的在线测量数据

可选系统配置

- 用于样品检测的离线实验室和增强型实验室系统
- 用于并排涂布生产线的分体系统
- 提供 ATEX 探头和系统设计

技术规格

测量范围:	0.3 至 250 微米 (涂层厚度)
精度:	涂层厚度的 +/-3% (标称值)* <i>*所提供的精度数字是基于在 0.2 至 250 微米的整个测量范围内使用 NIST 可追溯厚度标准进行的精度验证。</i>
卷绕速度:	高达 2000 英尺/分钟 高达 600 米/分钟
测量速度:	高达每秒 150 次
扫描速度:	高达 5 英寸 (125 毫米) /秒
温度范围:	0°C 至 55°C
卷材宽度:	可自定义
输出单位:	微米 microns 密耳 mils 克/平方米 g/m ² 磅/令 lbs/ream 毫克/平方英寸 mg/in ² 毫克/4平方英寸 mg/4in ²
操作系统:	Windows® 平台
产地:	美国制造
认证:	CE 已获批 SP 已获批 UL 已获批

集成选项

- SpecMetrix 系统可以通过 OPC、TCP/IP 或基于以太网的 PLC (如西门子 S7、Rockwell Control Logix) 进行集成, 用于实时收集测量数据或实现系统的完全控制和自动化。

注: 本设备及其使用方法受美国专利号 6,674,533、7,128,985、7,274,463、7,365,865 和 7,537,681 的保护, 另有其他美国 and 外国专利正在申请中。所有商标均被视为其所有者的财产。SpecMetrix® 是 Sensory Analytics 的商标。保留所有权利。Windows® 和 Excel® 是微软公司的商标。